ВЛИЯНИЕ ПОЛЕВОЙ ИОНИЗАЦИИ НА ЕМКОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЭЛЕКТРОДА

Жарский И.М., Слесаренко О.А., Бокун Г.С., Кожух А.В.

Изучение зависимости дифференциальной емкости от потенциала электрода широко используется для выяснения раскределения потенциала на границе раздела, влияния поверхностных состояний, определения концентрации мелких доноров или акцепторов и потенциала плоских зон [1]. Кроме того, по результатам измерений при высоких потенциалах, как показано в [1, 2], можно определять энергетические уровни глубоких дефектов. Однако при высокой концентрации примесей могут стать доминирующими эффекты полевой ионизации глубоких донорных уровней [3]. Таким образом, актуальным становится вопрос об учете взаимноговлияния примесей различной природы и явления их полевой ионизации па зависимость дифференциальной емкости от потенциала электрода. В настоящей работе для рассмотрения этой задачи используется модель *n*-полупроводникового электрода, согласно [1, 2].

При исследовании отдельного влияния примесей разной природы, имеющих различную энергию E_D залегания по отношению ко дну зоны проводимости, целесообразно разделить примесные донорные состояния на два типа: мелкие, попизированные полностью или частично за счет тепловых флуктуаций (их энергия $E_{D_1} \approx kT$, где k – постоянная Больцмана, T – температура), и глубокие, ионизация которых возможна при приложении внешпего потенциала ($E_{D_2} \ll E_{D_1}$).

В рамках используемой здесь одноэлектронной модели корреляционные эффекты и взаимодействие примесных центров между собой можно описать, приняв, что для каждого *j*-типа примеси имеет место «размытие» энергетического уровня в энергетической щели, характеризуемое плотностью распределения $D_j(E)$. Далее ограничимся рассмотрением равновероятного распределения в интервале энергий пириной 2 σ_j .

$$D_{j}(E) = \frac{1}{2\sigma_{j}}, \quad E_{D_{j}} - \sigma_{j} \leqslant E \leqslant E_{D_{j}} + \sigma_{j};$$

$$D_{j}(E) = 0, \quad E < E_{D_{j}} - \sigma_{j}; \quad E > E_{D_{j}} + \sigma_{j}.$$
 (1)

В свою очередь вклад *j*-го типа примесей в локальную плотность заряда определяется слагаемым [1]:

$$D_{D_j} = N_{D_j} \int_{E_Y}^{E_C} \frac{D_j(E) dE}{1 + \exp\{(E_F - E - \Delta E - e\varphi)/kT\}},$$
(2)

где N_{Dj} — интегральная плотность доноров *j*-го типа; E_c , E_v — энергии дна зопы проводимости и потолка валентной зоны; φ — потенциал электрического поля; e заряд электрона; E_F — эпергия уровня Ферми.

Слагаемое ΔE в (2) соответствует дополнительному по отношению к [1, 2] учету изменения заселенности уровней, обусловленному пе только величиной потенциала, но и его градиентом φ' .

Основной вклад (по сравнению с эффектом Штарковского расщепления) в ΔE вносит слагаемое, определяющее изменение величины потенциального барьера для электрона по механизму Френкеля – Пула (см. [4]). Ограничиваясь основным членом разложения для ΔE , принимаем [5]

$$\Delta E = \frac{2e\gamma e\varphi'}{\gamma \overline{4\pi\varepsilon\varepsilon_0}} \,. \tag{3}$$

После вычисления интеграла в (2) с учетом (1) и (3) получим

(

$$\rho_{D} = N_{D_{j}} \left(1 + \frac{kT}{2\sigma_{j}} \ln \left(\frac{1 + x_{F} x_{\varphi} x_{E} x_{D_{j}} x_{\sigma_{j}}}{1 + x_{F} x_{\varphi} x_{E} x_{D_{j}} x_{\sigma_{j}}^{-1}} \right) \right), \tag{4}$$

 $rge \quad x_F = \exp(E_F/kT); \quad x_{\varphi} = \exp(-e\varphi/kT); \quad x_E = \exp(-\Delta E/kT); \quad x_D = \exp(-E_D/kT); \quad x_{\sigma} = \exp(-E_D/kT); \quad$

 $=\exp\left(-\sigma_{j}/kT\right).$

В соответствии с отмеченным выше, локальная плотность заряда ρ в *п*-полупроводнике определяется вкладом мелких (j=1) и глубоких (j=2) доноров, а также электронами зоны проводимости:

 $\rho = \rho_{D_1} + \rho_{D_2} - N_C x_F x_{\varphi}, \tag{5}$





Рис. 1. Зависимость обратного квадрата дифференциальной емкости полупроводникового электрода от потенциала для σ₁= =0,01; σ₂=0,01. Пояснения, как и для последующих рисунков, даны в тексте

Рис. 2. Зависимость обратного квадрата дифференциальной емкости полупроводникового электрода от потенциала для $\sigma_1 = = 0,01; \sigma_2 = 0,2$

Рис. 3. Зависимость обратного квадрата дифференциальной емкости полупроводникового электрода от потенциала для $\sigma_1 = = 0.03; \sigma_2 = 0.3$

где N_C – эффективная плотность состояний в зоне проводимости.

В рассматриваемом случае плоской межфазной границы систему уравнений (4) и (5) замыкаем уравнением Пуассона в виде

$$\varphi'' = \frac{\rho}{\epsilon \epsilon_0} \,. \tag{6}$$

Нетрудно показать, что в нашем случае, хотя ρ Зависит не только от φ , но и от φ' , сохрапяется выражение для дифференциальной емкости $C(N_{D_f}=\text{const})$, приведенное в [1]:

$$C = -\frac{\rho}{\omega^*}.$$
 (7)

Согласно (7), достаточно ограничиться первым интегралом уравнения (6), переписав это уравнение в виде

$$\frac{1}{2} \frac{d(\varphi')^2}{d\varphi} = \frac{\rho(\varphi, \varphi')}{\varepsilon \varepsilon_0}.$$
(8)

Решение (8) с учетом (4) и (5) при нулевых начальных условиях определяет интересующую емкость (7) в зависимости от потенциала ф.

Результаты численных расчетов в координатах Мотта – Шоттки представлены на рис. 1–3. По горизонтальной оси отложен потенциал φ в вольтах, по вертикальной оси – C^{*-2} ($C=1,6\cdot10^{-2}C^*$). Расчеты выполнены при следующих исходных параметрах полупроводника: $N_C=10^{25}$ м⁻³; $\varepsilon=10$; kT=0,026 эВ; $E_{D_1}=-0,05$ эВ; $E_{D_2}=-0,5$ зВ; $N_{D_1}=N_{D_2}=0,1N_C$. Положение уровня Ферми определяется из условия электронейтральности при $\varphi=0$. Кривые, отмеченные болыми кружочками, построены без учета эффекта Френкеля – Пула; кривые, отмеченные черными кружочками,с учетом этого эффекта.

На рис. 1 представлены C^{*-2} , φ -зависимости, когда уровни доноров практически локализованы ($\sigma_1 = 0,01$ эВ; $\sigma_2 = 0,01$ эВ) в энергетической щели. На графиках на-

блюдаются экстремумы в области потенциалов, близких к значениям энергии залегания глубоких уровней. Причем учет эффекта Френкеля — Пула сглаживает немонотопность графика и сдвигает точки экстремума в область более низких потенциалов. Сравнение кривых на рис. 1 и 2 показывает, что влияние полевой ионизации аналогично уширению распределения для глубоких уровней. Дополни-тельный учет эффекта Френкеля – Пула приводит тогда (см. рис. 2) к монотонной зависимости емкости от потенциала, аналогичной полученной в работе [3]. При дальнейшем росте дисперсии распределения примесных уровней учет эффекта Френкеля — Пула уже не приводит (рис. 3) к качественным изменениям в характере кривых.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Мямлин В. А., Плесков Ю. В. Электрохимия полупроводников. М.: Наука, 1965. 337 c.

- 2. Deen M. H., Stimming U. // J. Electroanalyt. Chem. 1987. V. 228. Р. 135. 3. Слесаренко О. А., Жарский И. М. // Докл. АН БССР. 1988. Т. 32. С. 529. 4. Као К., Хуанг В. Перенос электронов в твердых телах. Т. 2. М.: Мир, 1984. 368 с. 5. Орешкин П. Т. Физика полупроводников и диэлектриков. М.: Высш. шк., 1977. 448 c.

Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова Минск

Поступила в редакцию 3.III.1989

УДК 541.183 C 1989

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА ФОНА НА АДСОРБЦИОННОЕ **ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИ-N-ЭТИЛ-4-ВИНИЛПИРИДИНИЙБРОМИДА** НА РТУТНОМ ЭЛЕКТРОДЕ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

Ермолин В.Б., Герович В.М., Дамаскин Б.Б.

Ранее нами было исследовано адсорбционное поведение катиона метилпиридипия на ртутном электроде [1]; в дальнейшем представляло интерес перейти к изучению адсорбции полимерных веществ на основе пиридиниевого катиона.

В настоящей работе рассматривается влияпис фонового электролита на адсорбционное поведение поли-N-этил-4-винилпиридинийбромида (ПЭВП) Br на ртутном электроде. Вещество любезно предоставили нам сотрудники кафедры вы-сокомолекулярных соединений МГУ В. А. Изумрудов и К. Н. Бакеев. Исследовались две фракции этого вещества с степенями полимеризации n=30-40 и 160-200.



Получить электрокапиллярные кривые с помощью традиционного электрометра Гуи не представлялось возможным, так как в данном случае процесс адсорбции идет чрезвычайно медлению и практически не удается достичь установления адсорбционного равновесия. Кроме этого, специфическое взаимодействие (ПЭВП)Вг со стеклом приводило к засорению капилляра, после чего делать дальнейшие измерения не удавалось.

Методом отрыва канли с использованием особого «веретенообразного» канилляра [2, 3] с долгим периодом капания (свыше 100 с) были сняты электрокапил-лярные кривые в водных растворах 0,1N Na₂SO₄, KCl и KBr с различными добав-ками (ПЭВП) Br. В качестве электрода сравнения использовался насыщенный каломельный электрод.

Область изученных потенциалов ограничивалась с анодной стороны потенциалом Е-0,1 В, положительнее которого наблюдалась низкая воспроизводимость значений пограничного натяжения о, а с катодной стороны – потенциалом Е= -1,0 В, отрицательнее которого происходило восстановление (ПЭВП) +.

Как показали измерения, адсорбционное поведение (ПЭВП)Вг в указанных пределах и не зависит от степени полимеризации.